# XRR 解析レポート

### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

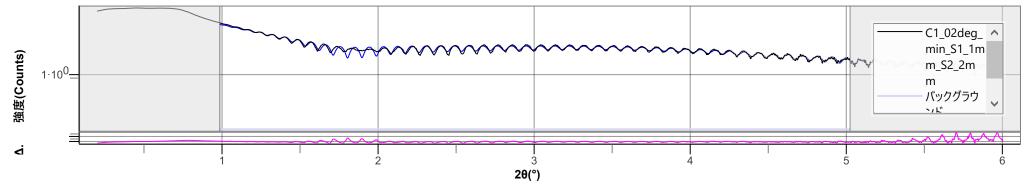
ステップ = 0.004 オフセット=0.000e+000 フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



1	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
	<b>✓</b>	L5	Fe2O3	0.694	Const	4.94999	Const	0.100	Con
	•			±0.017	精密化	±0.07	→最大 精密化	±0.03最小←	精密化
<b>✓</b>		L4	Fe2O3	1.588	Const	2.66945	Const	0.100	Con
	<u>~</u>	L4		±0.016	精密化	±0.02 最小←	精密化	±0.04最小←	精密化
	<b>✓</b>	L3	Fe ••	3.660	Const	7.87400	Const	0.067	Con
	V			±0.6	精密化	±0.06	→ <b>最大</b> 精密化	±0.02最小←	精密化
		L2	* ° Fe	87.894	Const	7.20848	Const	0.100	Con
	$\checkmark$	LZ		±0.02	精密化	±0.05	→ <b>最大</b> 精密化	±0.04最小←	精密化
	<b>✓</b>	L1	Fe Fe	0.000	Const	3.93700	Const	0.100	Con
		LI		±0.2 最小←	精密化	±0.16 最小←	精密化	±0.04最小←	精密化
		基板	🖸 Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con